

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 07-006729

(43)Date of publication of application : 10.01.1995

(51)Int.Cl. H01J 49/04
G01N 1/02
G01N 27/62
G01V 9/00
H01J 49/40

(21)Application number : 03-073918 (71)Applicant : CANADA

(22)Date of filing : 13.03.1991 (72)Inventor : LUDMILA L
DENIREWICHMAY

(30)Priority

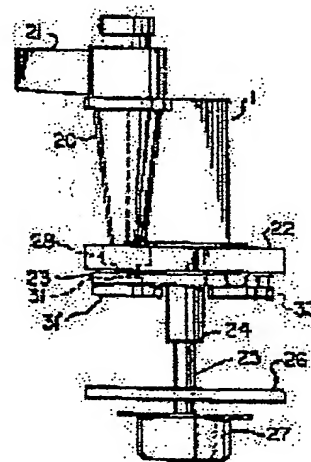
Priority number : 90 2012030 Priority date : 13.03.1990 Priority country : CA

(54) DETECTOR FOR HIDDEN EXPLOSIVE OR NARCOTIC

(57)Abstract:

PURPOSE: To detect a hidden explosive or narcotic by collecting particulates of discharged substance from the hidden explosives or a narcotic, heating them, vaporizing them and analyzing them with an ion mobility spectroscopic analyzer.

CONSTITUTION: A very small quantity of vapor is exhaled from the hidden explosive or the narcotic and adsorbed on the surface of dusts adhered to clothes, bags and other baggage. The dusts adhering to the baggage is collected by a vacuum hose connected to an inlet part 21 of a particle collecting cyclone 20. The particles collected pass through the cyclone 20 and are concentrated in a conical bottom part, and then accumulated on a frit 31 after passing through an opening part 28. By heating the frit 31, the vapor is sent into an ion mobility analyzer, so that the explosive or the narcotic is detected.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 13.03.1998

[Date of sending the examiner's decision 14.11.2000
of rejection]

[Kind of final disposal of application
other than the examiner's decision of
rejection or application converted
registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of requesting appeal against
examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平7-6729

(43) 公開日 平成7年(1995)1月10日

(51) Int.Cl. ⁸	識別記号	庁内整理番号	F I	技術表示箇所
H 0 1 J 49/04		4230-5E		
G 0 1 N 1/02	B			
27/62	Z	9115-2J		
G 0 1 V 9/00	A	9406-2G		
H 0 1 J 49/40		4230-5E		

審査請求 未請求 請求項の数32 F D (全 10 頁)

(21) 出願番号 特願平3-73918

(22) 出願日 平成3年(1991)3月13日

(31) 優先権主張番号 2, 0 1 2, 0 3 0

(32) 優先日 1990年3月13日

(33) 優先権主張国 カナダ (C A)

(71) 出願人 591070521

カナダ国

カナダ国 ケイ1エイ 0エル5 オンタ
リオ オタワ (番地なし)

(72) 発明者 ルドミラ エル. デニールウィッチーメイ
カナダ国 エム2エヌ 2エイ8 オンタ
リオ ノース ヨーク ハウンスロイ ア
ヴェニュー 36

(74) 代理人 弁理士 越場 隆

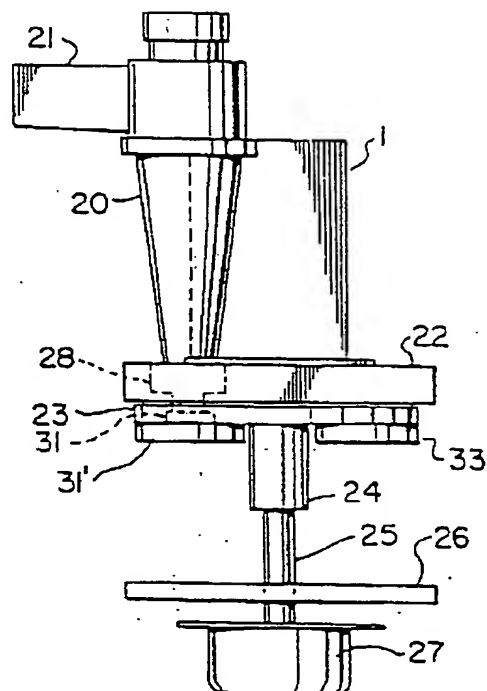
(54) 【発明の名称】 隠された爆発物または麻薬の検出器

(57) 【要約】

【目的】 イオン易動度分光分析器を用いて隠された爆発物または麻薬物が入っていると思われる容器の近傍の表面またはそれらを運ぶ人物の衣服から付着性の埃の粒子を回収することによって得られた物質の極微量のサンプルを分析する、隠された爆発物および麻薬の検出装置。

【構成】 埃の粒子は、時間がたつと、容器内に隠された爆発性または麻薬性物質から放出された上記を吸着する。プラスチック爆薬の上記圧は極めて低い、物理的な摩耗や操作によって周囲のその材料の固体微粒子を撒き散らす。慣性回収器を使用して、気流によって埃の粒子と微粒子を回収して、可動面上にある収集媒体上に堆積される。その後、イオン易動度分光分析器の入口部に近接する別の位置に移動させて、粒子を加熱して、その粒子から物質を蒸発させて、イオン易動度分光分析器中で分析する。

【効果】 可動面は、粒子用の複数の収集媒体を有することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】下記段階で構成されることを特徴とする物質の検出方法：

- (a) 上記物質を含んだ区域からガス流によって粒子を収集し、
- (b) 回収した粒子を収集位置で収集媒体上に堆積させた後、この収集媒体をイオン易動度分光分析器 (IMS) の入口部に配置し、
- (c) このイオン易動度分光分析器の入口部の近くで上記収集媒体および粒子を加熱して、この粒子から物質を蒸発させ、
- (d) 蒸発させた物質をガス流中に随伴させ、個々の粒子がイオン易動度分光分析器へ通らないようにしながら、このガス流を上記イオン易動度分光分析器のイオン化区域内へ送って蒸発した物質の組成を測定する。

【請求項 2】上記 (d) 段階で蒸発した物質を随伴するのに用いるガスが、この蒸発した物質を随伴する前に予め濾過された外気である請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】上記の濾過された外気の供給路がイオン易動度分光分析器のドリフト区域の入口部に接続されてドリフトガス流を形成し且つ校正ガスの導入装置を介してイオン易動度分光分析器のイオン化区域の入口部に接続されており、イオン易動度分光分析器を校正ガスによって校正することによって操作パラメータを変更できるようになっている請求項 2 に記載の方法。

【請求項 4】イオン易動度分光分析器の入口部に細長い管が設けられ、この管は、上記粒子がイオン化区域内に入るのを防止するように、ガス流に随伴された粒子がこの管の壁部と衝突するような角度を成し、イオン易動度分光分析器の入口部とイオン化領域との間には上記粒子がイオン化区域内に入るのを防止するための目の細かい金網が設けられている請求項 1～3 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 5】イオン易動度分光分析器の入口部に、分子が周囲を流れることができるプラグ部品が設けられおり、粒子がこのプラグ部品に衝突して上記イオン化区域内に入るのを防いでいる請求項 1～4 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 6】上記 (c) 段階中および (d) 段階中に上記収集媒体に加わる温度と、イオン易動度分光分析器の入口部の温度と、このイオン易動度分光分析器の内部の温度とを個別の温度に維持・制御する請求項 1～5 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 7】麻薬の検出に応用する際には上記 (a) 段階で麻薬を含むと思われる物品の周辺から粒子を回収し、上記 (c) 段階および (d) 段階で収集媒体を約 300℃の温度に加熱し、イオン易動度分光分析器の入口部を 300℃の温度に維持し、このイオン易動度分光分析器のドリフト区域およびイオン化区域を 280℃の温度に維持し、爆発物の検出に応用する際には上記 (a) 段階で爆発物を含

むと思われる物品の周辺から粒子を回収し、上記 (c) 段階および (d) 段階で収集媒体を約 180℃の温度に加熱し、イオン易動度分光分析器の入口部を約 175℃の温度に維持し、このイオン易動度分光分析器のドリフト区域およびイオン化区域の温度を約 100℃に維持する請求項 6 に記載の方法。

【請求項 8】上記 (c) 段階で収集媒体を約 100～450℃の範囲の温度に加熱し、上記 (c) 段階および (d) 段階でイオン易動度分光分析器の入口部の温度を 100～450℃の範囲の温度に維持し、このイオン易動度分光分析器のドリフト区域およびイオン化区域の温度を 100～300℃の範囲の温度に維持する請求項 1～7 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 9】上記 (d) 段階で粒子が随伴するのを防ぐために、上記 (b) 段階で用いる収集媒体が粒子が埋め込まれる半通気性の濾過材で構成されている請求項 1～8 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 10】上記 (a) 段階で、粒子が慣性式の回収装置によって収集される請求項 9 に記載の方法。

【請求項 11】上記 (a) 段階で、収集媒体の下方から吸引して上記濾過材に粒子を引き込み且つ埋め込むような請求項 9 または 10 に記載の方法。

【請求項 12】上記 (a) と (b) 段階が個別の半多孔性フィルタで構成される収集媒体を用いて実施され、粒子の回収後にこの収集媒体を別のイオン易動度分光分析器の入口部にセットする請求項 9～11 に記載の方法。

【請求項 13】上記収集媒体が、複数の回収媒体で構成された可動表面上に設けられており、上記 (a) 段階を第 1 の収集位置で実施し、この (a) 段階の終了後に、上記可動表面を移動させて粒子を含む収集媒体をイオン易動度分光分析器の入口部の近傍の第 2 の蒸発位置に配置すると同時に、第 2 の回収媒対を粒子の別のサンプルを収集するために上記収集位置へ移動させる請求項 9～11 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 14】上記収集位置と上記蒸発位置とが上記可動表面の同じ側に配置されている請求項 13 に記載の方法。

【請求項 15】上記 (d) 段階後に上記蒸発位置の回収媒体を第 3 の位置に移動し、その位置で収集媒体をさらに高い温度に加熱して、収集した粒子から収集媒体の残留物を除去する追加の段階を行う請求項 13 または 14 に記載の方法。

【請求項 16】上記 (e) 段階後に収集媒体を上記第 3 の位置から第 4 の位置へ移動させて、収集媒体を再度上記サイクルを開始する上記の第 1 の収集位置へ戻す前に、冷却する請求項 15 に記載の方法。

【請求項 17】上記可動表面が細長いテープまたは回転テーブルによって構成される請求項 13～16 のいずれか一項に記載の方法。

【請求項 18】校正ガスがニコチンアミド、塩素化炭化水素およびジクロロメタンのいずれか 1 つである請求項 3

に記載の方法。

【請求項19】較正ガスが、必要なイオンの生成効率を大きくするイオン分子化学反応を促進するように選択される請求項3に記載の方法。

【請求項20】イオン易動度分光分析器が排気出口部を有し、この排気出口部に減圧発生装置が接続され、イオン易動度分光分析器の入口側、イオン化区域の入口側、ドリフトガスの入口側および排気側を流れるガス流が制御器によって各々別々に制御されている請求項9に記載の方法。

【請求項21】上記(c)段階で収集媒体がランプ加熱されて徐々に温度が上昇され、徐々に高くなる蒸発温度で成分が蒸発させる請求項9に記載の方法。

【請求項22】上記(d)段階で、多数のピークを、成分および物質の同定用に格納した参照値と比較する請求項1～21のいずれか一項に記載の方法。

【請求項23】入口部と、イオン化区域と、ドリフト区域とを有するメンブレンを有しないイオン易動度分光分析器と；このイオン易動度分光分析器の近傍の蒸発位置で粒子を加熱することによって粒子から物質を蒸発させるための手段と；このイオン易動度分光分析器を介してガス流を供給して上記で蒸発した物質を随伴し、それをイオン易動度分光分析器へ送る手段と；粒子がイオン易動度分光分析器のイオン化区域内に入るのを防ぐためのイオン易動度分光分析器の入口部に設けられた手段とによって構成されることを特徴とする物質の検出装置。

【請求項24】蒸発した物質を随伴させるガス流としてのイオン易動度分光分析器の入口部に接続された空気の供給路と、この空気供給路に送られた空気を濾過する手段とを有する請求項23に記載の装置。

【請求項25】上記空気供給路をイオン易動度分光分析器のドリフトガス入口部に接続するドリフトガスとしての空気を供給する第2のラインと、試薬または較正ガスを放出する手段を備えた第3のラインとを有し、この第3のラインはイオン化チャンバの第3の入口部に接続されて試薬または較正ガスを放出する請求項24に記載の装置。

【請求項26】イオン易動度分光分析器IMSの入口部に角度を成して延びた管が設けられていて、ガス流に随伴された粒子がこの管の側壁と衝突するようになっている請求項23～25のいずれか一項に記載の装置。

【請求項27】粒子が埋め込まれる半通気性のフィルタ材料を備えた収集媒体上に粒子を収集するための手段を有し、粒子を加熱する上記手段が収集媒体中に埋め込まれた粒子を加熱し、イオン易動度分光分析器はその入口部とそのイオン化区域との間に粒子がイオン化チャンバに入るの防止する目の細かい金網を有している請求項23～26のいずれか一項に記載の装置。

【請求項28】収集媒体が、粒子を埋め込むことが可能な半通気性フィルタ材料で構成されている請求項27に記載

の装置。

【請求項29】イオン易動度分光分析器の入口部にプラグ部品が設けられ、分子はこのプラグ部品の周囲を流れ、ガス流に随伴した粒子は入口部でこのプラグ部品に衝突してイオン易動度分光分析器のイオン化チャンバに入るのが防止される請求項23～28のいずれか一項に記載の装置。

【請求項30】上記イオン易動度分光分析器の入口部の近傍に設けられた収集媒体を加熱する蒸発加熱器と、イオン易動度分光分析器の入口部、そのドリフト部およびイオン化区域用の個別に設けられた各ヒーターとをさらに含み、各ヒーターを個別に制御し、各ヒーターの温度を個別に設定する請求項23～29のいずれか一項に記載の装置。

【請求項31】上記収集手段とイオン易動度分光分析器とが互いに間隔を介して近接して配置されており、一連の収集媒体を備えた可動表面を用いて、1つの回収媒体が回収手段の回収位置に位置した時に他方の回収媒体がイオン易動度分光分析器の入口部の蒸発位置に配置し、上記可動表面は回収位置にある収集媒体を蒸発位置に移動させることができ、上記入口部で収集媒体の周囲にシールを形成して外気の随伴を防ぐようになっている請求項27または28に記載の装置。

【請求項32】収集媒体をさらに高い温度に加熱して、回収された粒子からの残留物を除去する第3の位置と、この第3の位置と上記回収位置との間に第4の位置とを有し、収集媒体を回収位置に戻す前にこの第4の位置で収集媒体を冷却し、回転テーブル上の収集媒体が複数の別のフリットで構成され、各フリットが抵抗ワイヤ上に配置されたガラス繊維で構成される請求項31に記載の装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【産業上の利用分野】本発明は、極微量の爆発物または麻薬物をイオン易動度分光計 (ion mobility spectrometer、IMS) を用いて分析するための隠された爆発物または麻薬物の検出用装置に関するものであり、特に、爆発物または麻薬物のサンプルを収集し、このサンプルを加熱・蒸発させ、その蒸気を上記IMS検出器へ送って検出するためのユニットに関するものである。

【0002】

【従来の技術】国際的なテロリズムの脅威に対する安全、特に空港の安全を確保するために、隠された爆発物および麻薬物を検出する手段の開発が強く望まれている。この問題は、1960年代の初期にニトログリセリンのダイナマイトが市場で入手可能になって以来から指摘され、多くの研究開発が行われてきた。しかし、国際テロの手口がより巧妙になり、TNTやDNTの他にEGDN、C-4、水ゲル/スラリー/エマルジョン、プラスチック爆薬といった新しい爆発物が使用されるように

なっている。これらの爆発物の多くは蒸気圧が低い
ため、これらの物質から出る蒸気、特に空港等の輸送施設
で取り扱われるスーツケースや鞆等に隠された爆発物
から放出される蒸気を検出するための試みが行われてき
ている。

【0003】バーリンガー(Anthony Barringer)の米国
特許第 3,759,617号と第 3,768,302号には、空中の微粒
子を回収・濃縮する方法および装置と、微粒から放出
された蒸気を分析する手段とが記載されている。これれ
らの特許は鉱物探査と地球化学探査に関するものである
が、米国特許第 3,759,617号の第6欄、第25～27行には
「本発明は麻薬や爆発物の検出のような他の遠隔探知に
も応用することができる」と記載されており、米国特許
第 3,768,302号の第6欄、第59～64行には「本発明は、
航空機の客室、手荷物室、税関区域、船舶係留区域等か
ら大量の空気サンプルを採取するために使用することも
できる」と記載されている。さらに、この特許には「大
気中の粒子を回収・濃縮して、麻薬物の微量な放出蒸気
を分析する」とも記載されている。

【0004】レイド(Neil M. Reid)達の米国合衆国特許
第 4,580,440号、第4,718,268号には、分析器として質
量分析計を用いて運送貨物のコンテナ中の密輸品を検出
する方法が記載されている。これらの特許には、麻薬や
爆発物のような密輸品の多くは蒸気圧は低いが、たとえ
包装されていたとしても、微粒子や蒸気が放出され、最
後にはこれら微粒子や蒸気は沈降して容器内の埃等の微
粒子と一緒に凝集するということが記載されている。また、
密輸品から放出された蒸気は、時間の経過とともに、濃
縮器の役目をするコンテナ中で非密品から出る粒子によ
って吸着されるので、コンテナ内を攪拌してこれら微粒
子を空中に舞い上げさせれば、コンテナ内の空気サンプ
ルを回収することができると記載されている。この空気サ
ンプルの回収は通常のサイクロンまたは金網製の円筒フ
ィルターを用いて行うことができる。この円筒フィルタ
ーでは、採取すべき空気サンプルを含んだ気流を円筒フ
ィルターの中心に入れ、放射方向外側へ取り出して、微
粒子を金網製円筒フィルターの表面で回収する。微粒子
の回収を良くするために金網製円筒フィルターの表面に
は軽油等の適当に粘性のある物質が被覆されている。コ
ンテナ中の微粒子が密輸品からの揮発性蒸気を吸着する
時間は極めて長いので、極めて大きな濃縮効果が得ら
れる。気流から微粒子を回収した後の金網製円筒フィ
ルターは分析器で分析される。米国特許第 4,580,440
号と第 4,718,268号では質量分析計が用いられる。分
析器では、加熱キャリアガスまたは誘導加熱ヒーターを
用いて金網製円筒フィルターを加熱して微粒子に吸着さ
れた蒸気を急速に放出させ、その蒸気を直ちに分析器へ
送る。質量分析計では、これらの放出蒸気を分析して爆
発物(TNT、RDX、PETN等)やドラッグ(コカ
イン、ヘロイン等)等の密輸品の検出が行われる。分析

器で放出される蒸気の容積は回収された空気の容積に比
べて大幅に小さいので極めて大きな濃縮効果が得られ
る。

【0005】米国特許第 3,128,619号には、液体クロマ
トグラフのカラムからの溶出物のような流体のモニター
装置が記載されている。この装置では、流体の一部を抜
き出し、それを供給リールから巻取りリールへ向かって移
動するテープ上に堆積させている。このテープは低温
(40～140℃)チャンバへ送られ、そこでテープ上に堆
積された流体の一部からキャリア流体が蒸発され、残留
成分のみがテープ上に残される。テープはさらに送っ
て、残留成分を高温度(140～160℃)チャンバに入れ、
テープ上の残滓の少なくとも1部分を揮発または熱分解
させる。次いで、気化された残滓はアルゴンまたはヘリ
ウム流等のピックアップガスによって質量分析計のような
分析器へ送られる。

【0006】米国特許第 3,788,479号には溶出物の試験
装置が記載されている。この装置では、コンベアの役目
をする多孔性アルミナ回転円盤上に塗布器を用いてサン
プルを塗布する。この円盤を回転させてサンプルを留
出物の加熱・放出装置中にセットし、そこで留出物をフ
ラッシュ蒸発させて円盤上にサンプルのみを残す。円盤
をさらに回転させて、円盤を均一に加熱する2つのノズ
ルを備えた炎イオン化検出器中にサンプルをセットす
る。その後、円盤をさらに回転して酸化装置内へ送り、
そこで円盤を焼いてサンプルの残滓を焼却し、検出装置
を通過した後の円盤をきれいにする。その後、円盤をさ
らに回転させて円盤冷却装置へ入れ、円盤の余熱を除去
する。この段階で、塗布器から別のサンプルを円盤に再
度塗布することができる状態になっている。米国特許第
4,055,987号には、液体クロマトグラフィからの溶出液
を質量分析計のイオン化チャンバ中へ運ぶための別の装
置が記載されている。溶出液は駆動車輪によって駆動さ
れるループ状またはベルト状の薄い金属リボン上に塗布
されてヒーターを通過することによって溶媒が蒸発され
る。次いでリボン上の残留物は真空ロックを通過してフ
ラッシュ蒸発器中へ送られ、残滓が急速に気化される。気
化したガスは質量分析計へ導入される。この米国特許
4,055,987号は上記の米国特許第 3,128,619号および第
3,788,479号と同様に、液体サンプルを乾燥させから分
析装置へ送るための装置に関するものである。

【0007】極く微量の化学分子を検出するのに特に有
用な装置はイオン易動度検出器である。この検出器は一
般に大気圧で作動され、携帯装置に組み込むことができ
る程度の寸法になっている。スパングレー(Glenn E. Sp
angler)の米国特許第4,311,669号および第 4,551,624
号にはいくつかの形式のイオン易動度検出器が記載され
ている。これらの特許には検出器の動作原理が説明され
ている。スパングレー(Glenn E. Spangler)に記載のイ
オン易動度検出器は反応チャンバとドリフトチャンバと

を有し、イオン化源は反応チャンバ内に配置されている。反応チャンバとドリフトチャンバとはイオン噴射グリッドで分離されており、ドリフトチャンバの他端にはコレクタ電極が設けられている。操作時には、被分析物質の蒸気はキャリアガスを用いてイオン易動度検出器のチューブへ運ばれる。この型式の検出器ではイオン噴射グリッドからコレクタ電極までのイオンの輸送時間を測定することによって極めて少量の化学分子を検出することができる。イオン噴射グリッドに周期的に短いパルスを加えてバイアスをかけてドリフトチャンバ内へイオン束を送る。各イオンの易動度(mobility)はその種類によって異なるので、短いパルスを加えた時間とイオン束中の各種イオンがコレクタに到達するまでの時間との差を測定することによって、イオン束中のイオンの種類を容易に同定することができる。

【0008】これまでのイオン易動度分光計では、外部からの汚染物を防ぐために、装置内部は密封する必要があると考えられてきた。そのために、従来の装置ではメンブレン(membrane)を用いている。問題の物質を移送できる効率の良いメンブレンを開発するために種々の研究が行われてきたが、現在のところ、メンブレンの透過効率が不十分なため、麻薬や爆発物の痕跡すなわち極めて微量の物質を検出する際にメンブレンを使用することは明らかに欠点である。さらに、これまでのイオン易動度分光計では、特定のキャリアガス、場合によってはさらに試薬ガス、が必要であると考えられてきた。本発明者は、被分析物質をイオン易動度分光計(IMS分析器)の入口部へ直接送るという提案は少なくとも1つあることは知っているが、この装置では、先ずサンプルを収集した後、凝縮し、予備濃縮し、その後、IMS分析器の入口部で再蒸発させる。従って、この装置はリアルタイムで検出することはできない。また、この装置にはいくつかの問題がある。すなわち、この装置では、IMS分析器の入口部および内部を清浄に維持することの重要性が認識されていないため、問題の物質が入口部の金網等に堆積すると、高分子物質がブレイクダウンする原因となる。従って、物質粒子から蒸気を生成することが可能な入力構造を有する、極微量でしか存在しない麻薬、爆発物およびその他の物質の検出器を開発することが強く望まれている。さらに、この装置は、物質粒子自体が検出器内部へ運ばれない状態で、上記蒸気をガス流(空気でもよい)中に随伴(エントレインメント)させることができるようになっていなければならない必要がある。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、隠された爆発物から発散する極微量の揮発性物質及び微粒子は衣服、手荷物、鞆トランク類または機内持ち込み手回り品上に存在する埃のわずかに粘着性の粒子の表面に吸収されるという原理に基づく、輸送施設または税関検査局での隠された爆発性及び麻薬性物質の改良された検出

手段を提供することにある。気流の空気のサンプルを採り、回収された粒子をその後イオン易動分光計の入口部に移動される回収媒上に堆積させることによって、これらの粒子は、爆発物または麻薬の固体微粒子と共に回収される。これらの粒子を加熱して、粒子からその物質を蒸発させ、その蒸気を直接または輸送線を介してイオン易動分光計に引き入れ、そこで、蒸気を分析する。本発明の別の目的は、イオン易動分析器(IMS)を使用する、隠された爆発性または麻薬性物質を検出する改良された方法において、これらの物質が隠されている区域またはその区域の近傍の表面上の粒子を慣性分離器によって回収し、その慣性分離器の底部で濃縮し、その粒子を可動表面に配置された回収媒上に堆積させ、その表面を動かして、その回収媒がIMS分析器の入口部に近接するように配置して、そこで、粒子を加熱して、それらの粒子から物質を蒸発させ、蒸発した物質をIMSの内部に引き込んで、分析する方法であって、蒸気可動表面は1つの回収媒がIMSの入口部に近接するように移動されると、上記慣性分離器の底部の下には別の回収媒があるように配置されている多数の回収媒を含むことを特徴とする方法を提供することにある。

【0010】

【課題を解決するための手段】本発明者は、周囲空気を適切に処理することによって問題の物質から蒸気を随伴するのに使用できることを発見した。これによってメンブレンやその他の複雑な密封技術が必要性が不要となる。本発明の1実施態様ではイオン易動度分光分析器を用いて隠された爆発物または麻薬物質を検出するための改良された装置が提供される。この装置では、慣性分離器で気流を形成し、上記物質が隠されている区域またはその区域の近傍の区域の表面上の粒子を慣性分離器で濃縮し、回転テーブル上に配置された収集媒体上に粒子と一緒に回収し、回転テーブルの表面を慣性分離器の底部に近接させ且つイオン易動度分光分析器の入口部に近接させる。回転テーブル上の収集媒体は回転テーブルが回転すると、収集媒体が慣性分離器の底部の下第1の位置から上記入口部に近接した第2の位置にくるように配置されており、この第2の位置にある手段は収集媒体を加熱して、収集媒体上の粒子から物質を蒸発させて入口部に導入し、また、第2の位置の手段は上記粒子を第1の温度に加熱して、第1の低い蒸気圧を有する物質を蒸発させる手段と粒子をより高い第2の温度に加熱して第2の低い蒸気圧を有する手段とを備えている。好ましい1実施態様では、上記テーブルは、上記回収媒を第3の位置に配置させるように回転することができ、この第3の位置には、該回収媒をより高い温度に加熱して、上記回収媒を洗浄することができる。

【0011】本発明のまた別の実施態様ではイオン易動度分光分析器を有する隠された爆発物の検出装置が、爆発物が隠されている可能性のある容器の表面の周囲の空

気のサンプルを採り、その表面上またはそれに近接した表面上の粒子を回収するためのサイクロンを備え、このサイクロンは、少なくとも2つのフリットを運ぶ回転テーブル上に底部が直接され、上記粒子を濃縮し、そのテーブルは回転して、1つのフリットを上記粒子と共にイオン易動分光計の入口部の近接したその表面上に、もう1つのフリットを上記入口部の近傍の上記フリットを該粒子から物質が蒸発する温度に加熱する手段とこの蒸発した物質を該入口部に輸送する手段とを備える上記底部の下に配置することができ、次に、また上記テーブルが回転して、上記1つのフリットを洗浄位置にある、該フリットをより高い温度に加熱して、上記微粒子のフリットを洗浄する手段を備える上記洗浄位置に配置し、該微粒子から物質を蒸発させる温度に上記フリットを加熱する手段は、第1の低い蒸気圧を有する物質を蒸発させる第1の温度まで該フリットの温度を上昇させる第1の手段と第2の低い蒸気圧を有する物質を蒸発させるより高い第2の温度まで上記フリットの温度を上昇させる手段とを備えることを特徴とする。本発明のさらに別の実施態様では、半通気性で、高温耐性のある有機的に中性のテープ媒を使用する増分テープデッキは、回収段で埃粒子を回収し、この粒子を脱着段に輸送するために使用されるが、このテープは制御された逐次的な方法で取り外すことができる。また、他の加熱手段、例えば、レーザを使用することができる。この場合、必ずしも粒子を回収する必要がなく、その代わりに、粒子流をレーザによって蒸発させることもでき、または、レーザを使用して、回収した粒子を蒸発させることもできる。また、蒸気である物質を検出するためには、分子を回収して、次に、加熱して蒸気を生成させる段階を除くこともできる。その代わりに、蒸気を、直接、分析器に入口部に流れ込むガスにエントレインメントさせる。本発明は、添付図面を参照して行う以下の実施例の説明によってより明らかとなろう。

【0012】

【実施例】図1に示した従来の典型的なイオン易動度検出器1は入口部12と、反応区域15と、イオンドリフト区域16とを有している。イオン噴射器すなわちシャッターグリッド3は反応区域15内のイオン化ソース5とイオンドリフト区域16との間に配置されている。イオン化ソース5はニッケルの放射性同位体⁶³Niのようなβ粒子源となる材料で構成することができる。図1に示した検出器では、入口部12の入口にメンブレン13が張られている。動作時には、管10に接続されたサンプルポンプによって、メンブレン13の外側表面にサンプルガスの連続流れが形成され、サンプルガスは入口部14を通過する。管9から流された試薬とキャリアガスとの混合物がメンブレン13の内側表面上を通過し、入口11を通過して反応イオン化区域15に入る。試薬とキャリアガスの混合物がメンブレン13の内側表面を擦る際に、メンブレン13を介し

てサンプルガスから拡散した分子と混合される。この混合ガスは反応チャンバ15内でイオン化ソース5によってイオン化される。キャリアガスとの混合物中のサンプル分子の濃度を希釈するために、適当に精製した空気または窒素等の希釈ガスを管8を介して反応チャンバ15に導入することもできる。また、各ガスを完全に混合させるために、標準的なディフューザ4を反応チャンバ15の入口部に設けることもできる。反発グリッドの役目をするディフューザグリッド4からコレクタ電極2までイオン易動度検出器の長手方向に沿って電位勾配が形成される。イオン化された分子はシャッターグリッド3へ向って加速され、イオン化されていない分子も脱気孔7に向って流れるガス流に乗ってシャッターグリッド3に向かって運ばれる。イオン化されていない分子の大部分はキャリアガスであり、このガスは脱気孔7を通過して検出器から排気される。この検出器は大気圧の近くの圧力で運転されるので、イオン化されたサンプル分子を生成しようとするガス分子同士が互いに衝突し、反応チャンバ15内で既にイオン化されているキャリアガス分子が脱イオン化され、従って、イオン化された分子が反応チャンバ15に対向したグリッド3（このグリッド3はイオンの通過を防ぐためにバイアスされている）の側で脱イオン化される。生成したイオンが陽イオンになるか陰イオンになるかは、被検出物質と試薬およびキャリアガス中に随伴される蒸気によって決まる。一般に、ヘロイン、コカイン等の麻薬からは陽イオンが生じ、爆発物からは陰イオンが生じる。ディフューザグリッド4とコレクタ電極2にはイオンを電極2へ向かって運ぶためのバイアスが加えられる。

【0013】運転時に、グリッド3に短い電気パルスを印加してグリッドにバイアスを加えると、陽イオンまたは陰イオンのイオン束がドリフト区域16中に入り、コレクタ電極3に向かって加速される。ドリフト区域16内のイオンは、グリッド3にパルスを印加した後の一定の時間(discrete time)内に落下する。この時間は各イオンの可動度の形式に依存するので、コレクタ電極2に到達したイオンの種類を決定することができる。管6を介してドリフトガスを噴射することによって、イオン化されていないサンプル分子を脱気孔7を通してドリフト区域16からスイープし、それによって、新たにサンプルイオンが生成しないようにする。

【0014】上記のイオン検出器1ではメンブレン13が入口部12に張ってある。これに対して、本発明ではメンブレンが無く、キャリアガス、試薬およびサンプルガスで構成される混合ガスが入口部11に直接噴射される。このメンブレンが無い装置はそれが有る装置に比べて多くの利点、例えば、感度が高く、瞬間応答性が高い等の利点がある。

【0015】本発明は、隠された爆発物からは極微量の蒸気が発散し、この極微量の蒸気は衣類、鞆、その他の

荷物に緩く付着しているダスト（埃）の粒子の表面に吸着されるという原理に基づいている。この原理は、爆発物が貯蔵されていた時間がダスト粒子に蒸気が吸着される時間より長い場合には特に当てはまる。また、爆発物の極めて小さい粒子は、機械的な摩耗やハンドリング操作によって、爆発物を隠している包みまたは容器から逃出する。この小粒子は、包みの外側表面やその近傍の表面に付着するか、これら表面に付着した埃の粒子に吸着される。緩やかに吸着または付着したこれらの爆発物の小粒子と、他の表面付着微粒子をサンプリングし、予備濃縮した後に加熱することによって、微粒子から爆発物を蒸発させ、蒸発した物質をイオン易動度分光分析器の入口部に引き入れ、サンプリング区域から得られた各種の分子を同定する方法は、隠された爆発物を容易且つ高い信頼性で検出する方法である。サンプル粒子を収集するには、例えばサイクロンを使用して気流を生じさせ、スーツケースやその他の物品の縫ぎ目のエッジ周辺部からサンプルを採り、収集した粒子を加熱して、粒子から物質を蒸発させる。

【0016】図2、図3は本発明によるサンプリング／脱着装置を示しており、図2は装置を上方から見た図面であり、図3は装置の側面図である。この粒子収集用のサイクロン20は入口部21を備え、この入口部21には、スーツケースや荷物の縫ぎ目のエッジ周辺のサンプルを採るための真空ホース（図示せず）が連結することができる。サイクロン20は支持プレート22に固定されており、サイクロンの底部はプレート22の開ロ部28へと延びている。通常のサイクロンでは、粒子は接線方向に出るが、本発明ではサイクロンの底部を変更して、接線方向の粒子流を再度軸線に沿った下降流に変える。収集した粒子はサイクロンの円錐形底部で濃縮され、開口部28を通してフリット31上に堆積する。支持プレート22の下回転テーブル23上には4つのフリット31、32、33、34が配置されている。各フリット31、32、33、34はガラス繊維フィルタで被覆された抵抗加熱ヒーターによって構成されていて、急激な加熱・冷却が可能のように低い熱質量を有している。フリット31はベース31'上に配置され、回転テーブル23の開ロ部の中に挿入されている。他のフリット32、33、34とそれらのベース（図にはベース33'が示されている）は参照番号31のものと同じで、回転テーブル23の周辺部に等間隔に配置されている。この回転テーブル23は下方支持プレート26を貫通して伸びたシャフト25に支持されている。回転テーブル23は下方支持プレート26の反対側に配置されたステッピングモータ27によって回転される。このモータはシャフト24、25を介して回転テーブルに連結されている。この回転テーブル23が90°回転すると、フリット31はその前のフリット32が占めていた位置に移動され、このフリット32はイオン易動度分光分析器IMSの入口部の真下にある。

【0017】図4、図5、図6は、本発明の方法を実施

するのに適するように変更したイオン易動度分光分析器IMS 60が示されている。このイオン易動度分光分析器60は以下で詳細に説明するサンプル入口部62と、この入口部62上に設けられたイオン化チャンバ64と、このイオン化チャンバ64上に設けられたドリフト管66とを含んでいる。平坦な収集器の形をした収集媒体は参照番号68で概念的に図示されている。この収集器の各種形式については後で詳細に説明する。収集器68の下方には脱着流用のダクト72を備えたヒーター70が配置されている。正圧ポンプ74によって吸引された外気はフィルタ76を通して湿分と炭化水素とが除去される。濾過後の外気は第1サージタンク78に送られる。このサージタンク78には圧力ゲージ80と大気に排気するための第1圧力逃し弁82とが取り付けられている。サージタンク78の第1のライン84には第1圧力制御弁86とフィルタ88とが設けられている。このライン84はドリフト管66のドリフトガス入口部90に接続されている。第2のライン92はサージタンク78とダクト72との間を接続している。この第2のライン92には第2圧力制御弁94とフィルタ96とが設けられている。第3のライン98は、サージタンク78と、イオン化チャンバ64の入口部100とに接続されている。このイオン化チャンバ64には、例えば校正ガスまたは試薬ガスが供給される。第3のライン98には制御弁102と、ヒーター104と、校正物または試薬を収容した浸透管（permeation tube）106とが設けられている。これらの校正物または試薬は、加熱された時に一定量をライン98を介して気流中に放出する。従って、入口部100を介してイオン化チャンバ64中に入る気流中には一定量に調節された校正物が含まれる。イオン化チャンバ64には排気口すなわちベントロ110が設けられている。このベントロ110はベントラインを介して排気用の第2サージタンク114に接続されている。このサージタンク114内は、吸引ポンプ116によって減圧が維持されている。また、このサージタンク114には圧力ゲージ118と圧力逃し弁120とが設けられている。フィルタ122は、イオン易動度分光分析器から来る全ての残留物を凝縮させるために設けられている。また、圧力制御弁124と補助のフィルタ126も設けられている。

【0018】図5、図6は、入口部62と、ヒーター70との詳細図で、入口部62はイオン化チャンバ64への接続端部132を有する石英管130で構成されており、石英管130の他端部134は外側にラッパ状に拡大している。また、石英管130の底面136は研磨されて平らな環状密封面を形成している。石英管130は、石英管の入口部の導入管138を所望温度に維持するためのヒーターを備えたスチールハウジング（図示せず）内に収容されている。ヒーター70はステンレス鋼で作られたリング状密封部品140を備えている。また、ヒーター70およびダクト72を鉛直方向に移動させるための手段142、例えば電磁作動装置等が設けられている。フリット31のガラス繊維フィ

ルタがイオン易動度分光分析器60の下方に位置すると、ソレノイド 142が駆動されて、密封部品 140がフリット 31に押圧され、フリット31は環状密封面 136に押圧されてダクト72が入口管 138に対して密封される。次いで、抵抗加熱ワイヤによってヒーター70を2段階の加熱サイクルで加熱して、急速な2段階分散 (dispersion) サイクルを行う。この2段階加熱サイクルでは、先ず最初に、ガラス繊維フィルタを約 110℃に加熱して粒子からEGDNを分散させ、次いで、温度を約 200℃に加熱してDNTまたはその他の種類の爆発物を分散させる。すなわち、熱分散の研究から、ほとんど全種類の爆発物の分子は熱的に粒子から脱着させることができるということは分かっているが、最適温度を選択する際に、熱的に影響を受け易く、高温では分解するEGDNのような分子もあれば、粒子から熱脱着させるには温度を高くしなければならないDNT、TNT等の他の爆発物もあるということに注意する必要がある。そのため、2段階の温度サイクルで、110℃でEGDNを脱着させ、200℃で他の爆発性化合物を脱着させる。米国特許第 4,718,268号には、一般的な薬物と爆発性化合物の最適脱着温度のリストが記載されている。この特許の内容は本願明細書の一部を構成する。粒子から脱着された蒸気はイオン易動度分光分析器の導入管中に吸引され、分析される。特定物質または特定の範囲の物質のみを検出する場合には単一の脱着温度で加熱するだけでよいということは理解できよう。

【0019】上記と同時にイオン易動度分光分析器60が作動される。従って、脱着ガス流が第2のライン92とダクト72とを通過して送られ、密封されたフリット31を通過して入口導管138に入る。この入口導管138は所望温度を維持するために加熱されている。蒸気を随伴したガスは入口導管138の内部に吸引された後、イオン化チャンバ64内に入り、そこで蒸気が公知方法によってイオン化され、ドリフト管66の中へ入る。同時に、第1のライン84を介してドリフト管66内にドリフトガスが供給されて、イオン易動度スペクトルが描かれる。イオン化チャンバ64およびドリフトチャンバ66も、以下で説明する所望温度に加熱される。これによって、イオン易動度分光分析器60を多数の変数で操作することができる。これらの変数は第3のライン98を設けることによって補正することができる。すなわち、問題の物質からの蒸気を含むガスを導入する前に、被検出物質と対比可能な公知特性を有する較正ガスをライン98を介して導入して測定を行って、イオン易動度分光分析器の較正をしておくのが好ましい。あるいは、ある物質を検出する際に入口 100を介して試薬ガスを導入することもできる。イオン易動度分光分析器 IMS 60 を作動している間は、公知の方法で吸引ポンプ 116とライン 112を必要な減圧状態にして排気 110をする。

【0020】本発明では、従来のイオン易動度分光分析

器とは違って、メンブレンが存在しないので、イオン易動度分光分析器 60 中に粒子が入るのを防ぐためその物理的障壁はない。従って、本発明では、放電やアーク放電、さらには信頼できない誤動作の原因となる粒子の検出器への進入を防ぐための種々の手段を提供する。本発明では、先ず、半通気性物質のフリット31に粒子を埋め込んで粒子をフリット31に回収する。粒子の埋め込みを多くするために、サイクロン20の下方に吸引装置を設けることもできる。粒子がフリット31に埋め込まれると、粒子が遊離する危険性が大幅に減少し、加熱により蒸気のみが発生するようになる。また、フリット31から粒子が分離してイオン易動度分光分析器60への流れに随伴するのを防止するために、石英管 130はL字型にしてある。従って、粒子はL字型のアングルの外側へ投げ出され、その壁に付着する。ガス流中に粒子が大幅に随伴するような場合には、石英管 130にプラグを設けて、その管内を通過する分子流に影響を与えずに、同様な方法で、粒子を捕捉することもできる。さらには、図4に参照番号 150で概略的に図示したように目の細かい金網をイオン化チャンバ64の入口部に設けることもできる。この金網は一般に6ミクロンの開口を有し、金メッキしたニッケルで作ることができる。この金網の機能は3つある。すなわち、ガス流中に随伴した粒子を捕捉・停止させ、ガス流を分散させてイオン化チャンバ64内に均一な流れを作り、イオン化チャンバ64からイオンが逆流するのを防止する。使用時には、イオン易動度分光分析器60を極めて清浄な状態に維持することが重要であることが分かっている。従って、ある期間使用した後、石英管 130を清浄な管と取り替えると同時に、入口メッシュ 150も一定期間の経過後に交換するのが好ましい。

【0021】多くの金属は多くの有機物質の分解を引き起こすので、メッシュの材料の選択は重要である。また、フリット31またはその他の収集媒体の材料の選択も重要である。フリット31はガラス繊維によって作られている。以下で詳細に説明する別のテープ装置では、厚さが数1/10000 インチのテフロンテープを用いることもできる。このテープは織布またはメッシュ状のテフロンで作るのが好ましい。

【0022】ヒーター70の温度、従って脱着温度と、入口管 130の温度と、検出器60の温度は個別の温度に維持する。例えば、爆発物の場合には、ヒーター70を180℃、入口管 130で175℃、検出器60を100℃の各温度にすることによって、よりリッチなスペクトルが得られるということが分かっている。熱脱着後は、回転テーブルを90° 回転させてフリット31を参照番号35の位置に配置する。この位置は前のフリット33が配置されていた位置である。この位置でフリット中のガラス繊維フィルタの温度を400℃に上げて、高温洗浄サイクルを実施する。その後、回転テーブルをさらに90° 回転させてフリットの冷却位置に配置する。フリットの熱容量が小さいの

で、加熱・冷却は極めて迅速に行うことができる。冷却段階の位置は、図2に示したようにフリット34が前に占めていた位置である。このように、4つのフリット31～34はステッピングモータ27によって一つの位置から他の位置へと回転される。第1の位置ではサイクロンによって作られた気流から粒子がその底部で濃縮され、フリット上に堆積され、第2の位置では粒子から物質が蒸発され、その蒸気がイオン易動度分光分析器の入口管の中に吸引され、第3の位置ではフリット上のフィルタが400℃に加熱されて洗浄され、第4の位置では冷却される。既に述べたように、ドリフト管用ヒーターと入口管用ヒーターとを別々に設けて、物質がこれらの壁面上に堆積しないような温度に維持することによって、検出感度を向上させる。これらのヒーターは室温から250℃の範囲の温度に調節でき且つ最適性能に設定することができる。1つのモデルでは、動作温度を170℃にした場合のドリフト時間は20分以下であるが、120℃の温度ではDNTに対する感度と浄化時間が悪くなった。

【0023】図7は、サンプルを収集し、そのサンプルをイオン易動度分光分析器へ送るための別の形式の装置を示している。この装置では、粒子はサイクロン20によってテープ42上に堆積する。テープ42は不活性で且つ高温耐久性のある例えば金網の上に支持されたガラス繊維または厚さが数1/10000インチのテフロンで作ることができる。この場合、テープは通気性を有し、サイクロン20の底部で回収された粒子は、テープ42を挟んでサイクロンの底部とは反対側に配置された吸引装置43によってテープの表面上に吸引される。テープ42は無端ループすなわち2つのローラ40、41上を移動するベルトであり、サイクロン20と吸引装置43はローラ40の近傍に配置されている。イオン易動度分光分析器60は他方のローラ41の近傍のテープ42上に配置されている。イオン易動度分光分析器の入口部の近くのテープ42の下にはヒーター44が配置されている。このヒーター44は種々の形態、例えば、テープ42が導電性金網の支持材上に支持されたガラス繊維である場合には誘導加熱器をすることができ、また、前記の実施態様に記載のヒーター70と同じものにすることができる。このヒーター44は、急速2段階脱着サイクル、すなわち、先ずサンプルが堆積したテープを約110℃に加熱してEGDN等の物質を脱着させ、次に、約200℃に加熱してDNT等の物質を脱着させることができるように設計されている。また、単一段階すなわち単一の温度サイクルで使用することもできる。この加熱サイクルで放出された蒸気はイオン易動度分光分析器の入口部に吸引され、分析される。操作時には、先ずサイクロン20によってサンプルをテープ42上に堆積させる。次に、テープを前進させて収集したサンプルをヒーター44の近くに配置する。同時に、テープ42の汚れていない部分がサイクロン20の下方に来て、最初のサンプルの分析と同時に別のサンプルを収集する。サンプルの残留物

をテープから除去する際には、残留物の付いたテープをローラ41の下側に位置したヒーター45の所に位置させる。このヒーター45はテープを約400℃に加熱して、全ての残留物をサンプルから除去し、テープを浄化する。

【0024】図8は、さらに別の形式のテープ52の表面上にサンプルを収集する装置が示されている。この装置では、供給リール50からのテープ52がピン53、54上を通過して巻き取りリール51へ送られる。ピン53、54は、サンプル収集用サイクロン20およびイオン易動度分光分析器1からテープを一定間隔の位置に配置する役目をしている。これらのテープ、供給リール、巻き取りリールおよびピン53、54の全ては点線で示した使い捨てカセットの中に配置することができる。

【0025】上記の検出器は、パスワードで保護された一連のメニューで調節可能な多数のパラメータを有するマイクロプロセッサの制御下に運転される。オペレータがパスワードを入力すると、入力されたパスワードが正確であれば、ディスプレイで制御メニューを変化することができる。オペレータはこのメニューを用いてヒーターの設定温度、シャッターグリッドのパルス幅、イオン易動度分光分析器のサイクル時間、各スペクトルに対するイオン易動度分光分析器の合計走査の数を制御し、ピーク同定制御メニューを入力することができる。このマイクロプロセッサには、検出済みのイオン易動度のスペクトルを参照用として格納したり、予め格納されている麻薬および爆発物の易動度スペクトルまたはバックグラウンド信号に対する検出信号の比較手段も設けられている。上記の好ましい実施態様は特許請求項の範囲に定義の本発明の精神および範囲を逸脱しない限り、種々変更することができる。例えば、表面から粒子を収集するためにサイクロンや慣性式の分離器以外の装置を使用することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は従来のイオン易動度分光分析器(IMS)を示す図。

【図2】本発明によるサンプルを収集し、収集したサンプルをIMS分析器へ送る装置を上方から見た図。

【図3】図2に示した装置の側面図。

【図4】本発明方法を実施するのに適するように変更したIMS検出器の図。

【図5】IMS検出器の入口部およびヒーターの拡大詳細図。

【図6】IMS検出器の入口部の拡大図。

【図7】本発明のサンプル用テープ移動装置を示す図。

【図8】テープ、供給リールおよび巻き取りリールが使い捨てカセット中に収容した本発明の別のサンプル用テープ移動装置の図。

【符号の説明】

- | | |
|---------------|----------|
| 1 イオン易動度分光分析器 | 12 入口部 |
| 13 メンブレン | 15 イオン化区 |

域

16 イオンドリフト区域

21 入口部

ル

31~34 フリット

42 テープ

20 サイクロン

23 回転テープ

40、41 ローラ

60 イオン易動

度分光分析器

62 入口部

ヤンパ

66 ドリフトチャンバ

74 ポンプ

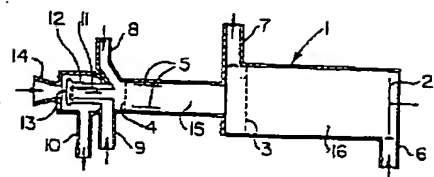
78 サージタンク

64 イオン化チ

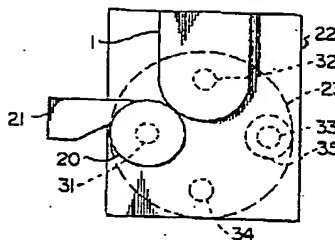
70 ヒーター

76 フィルタ

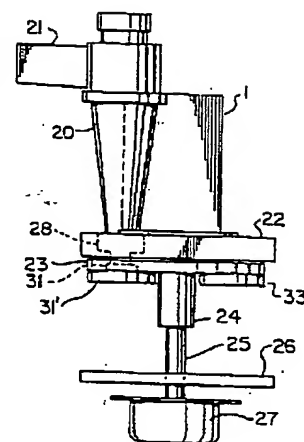
【図 1】



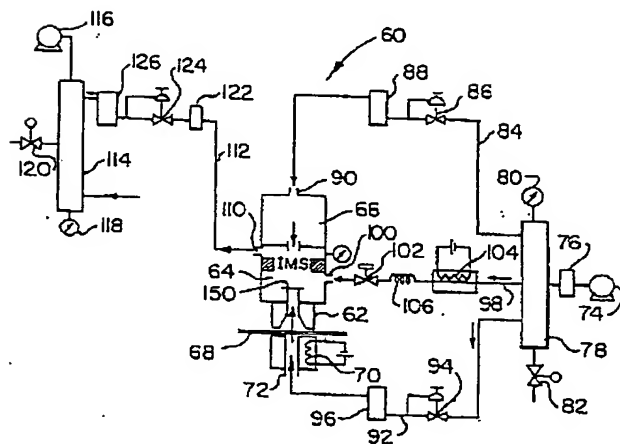
【図 2】



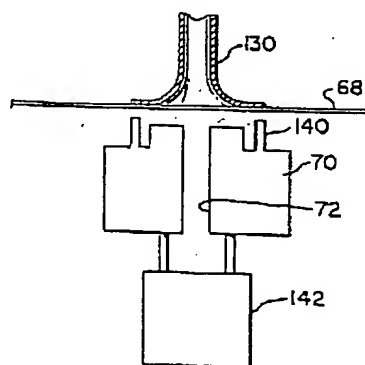
【図 3】



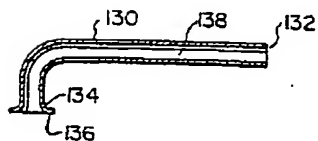
【図 4】



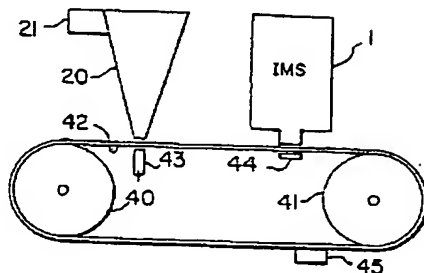
【図 5】



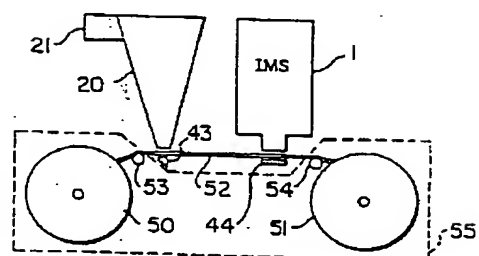
【図 6】



【図 7】



【図 8】



【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 7 部門第 1 区分

【発行日】平成 11 年（1999）7 月 9 日

【公開番号】特開平 7-6729

【公開日】平成 7 年（1995）1 月 10 日

【年通号数】公開特許公報 7-68

【出願番号】特願平 3-73918

【国際特許分類第 6 版】

H01J 49/04

G01N 1/02

27/62

G01V 9/00

H01J 49/40

【F I】

H01J 49/04

G01N 1/02 B

27/62 Z

G01V 9/00 A

H01J 49/40

【手続補正書】

【提出日】平成 10 年 3 月 13 日

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】下記段階で構成されることを特徴とする物質の検出装置：

（a）上記物質を含んだ区域からガス流によって粒子を

収集し、（b）回収した粒子を収集位置で収集媒体上に堆積させた後、この収集媒体をイオン易動度分光分析器（IMS）の入口部に配置し、（c）このイオン易動度分光分析器の入口部の近くで上記収集媒体および粒子を加熱して、この粒子から物質を蒸発させ、（d）蒸発させた物質をガス流中に随伴させ、個々の粒子がイオン易動度分光分析器へ通らないようにしながら、このガス流を上記イオン易動度分光分析器のイオン化区域内へ送って蒸発した物質の組成を測定する。